DEVELOPMENT OF FIELD-EMISSION ELECTRON GUN FROM CARBON NANOTUBES (2)

Yasufumi Hozumi[†]

School of High Energy Accelerator Science, The Graduate University for Advanced Studies (GUAS/AS), Satoshi Ohsawa, Takashi Sugimura, Mitsuo Ikeda Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) 1-1 Oho, Tsukuba, 305-0801, Japan

Abstract

We have been developing a high brightness electron gun utilizing carbon nanotube (CNT) cathode since 2001. Recently we succeeded to achieve a realistic-size cold cathode which could stand comparison with current densities of dispenser cathodes conventionally used in accelerators all over the world. The anode current was obtained to 0.48 A from the CNT-cathode of 2.6 mm diameter, which current density reduced from the anode current was about 9.1 A/cm² under a condition of 128 kV-DC acceleration voltage in pulse operations of 50 pps using about 8 ns pulses. The emission current was very stable in the long-term-period operation for about 3 weeks under about 10^{-6} Pa vacuum pressure.

カーボンナノチューブ冷陰極を持つ電界放出電子銃の開発(2)

1.はじめに

我々は昨年のリニアック技術研究会において、幅 65 ns、繰返し数 50 pps のグリッドパルス、及びグ リッド - アノード間の加速電圧 100 kV を用いて ビーム試験を行った結果、スクリーン印刷法によっ て成膜された 6 mm¢ の CNT カソードの電流密度 を 0.4 A/cm² と報告した^[1]。

今回、新たに(株)JFEエンジニアリング社から アーク放電法による 2.6 mm¢高結晶 CNT カソー ドのご提供を受け、加速電圧 128 kV の下、8 ns の 実用的なパルス幅にてビーム試験を行い、カソード の電流密度が 9.1 A/cm² に達した。この成果により、 従来までの含浸型熱陰極に代わる、CNT冷陰極を持 つ高輝度電子銃の実用化が見えてきた。

2 . CNT**カソー**ドの電界放出試験

2.1 CNTエミッタからの電界電子放出

CNT は 1991 年に日本で発見され、その電子エ ミッタとしての高いポテンシャルについては早くに 指摘され、1995 年には最初の電界電子放出特性の 報告がなされた^[2]。この電子放出のメカニズムにつ いては、CNT Tip へ高電界が集中することにより、 CNT 表面の電子を拘束しているポテンシャル障壁 が歪曲して浅く且つ薄くなり、拘束されていた電子 がトンネル効果によって真空中に引き出されるとい う説明がなされている。1998 年には、CNT を電子 源とした光源管デバイスの試作が行われ^[3]、その長 寿命と高輝度、そして安定した電子放出特性が確認 された。また、電界放出顕微鏡法(FEM)や電界イオン顕微鏡法(FIM)を用いた CNT Tip 構造と電子放出特性とに関する調査も精力的に行われてきており、CNTエミッタに関して理解が進んできた。

こうした背景があり、我々はヒータが不要で且つ カソードの小面積化が図れる CNT 冷陰極を用いた 加速器用グリッドドライブ電子銃の試作を 2001 年 度より開始し、本研究会等において報告してきた ^[1,4]。今回、CNT 陰極を高純度で高結晶性のものに 代え、パルス幅も実用レベルにまで縮めて試験を 行ったので以下に報告する。尚、電子銃テストスタ ンドの構成や測定系については昨年度の報告を参照 されたい^[1]。

2.2 *I-E* 特性

図 1 に本カソード(陰極面の直径 2.6 mm¢,電子放出面積 5.3 mm²)の電子放出特性を示す。縦軸 はビームキャッチャで捉えた、加速されたアノード のビーム電流から換算したカソードの電流密度、横 軸はグリッド - カソード間に印加された電界強度で ある。青の菱形のラインがグリッド - アノード間の 加速電圧が 100 kV のときのプロットであり、グラ フ上方に一点だけ飛んで見える黒い縁取りのポイン トが、グリッド - カソード間の電界強度を最大に 保ったまま加速電圧を 100 kV から 128 kV に上昇 させたときの値である。その推移の様子を図 1 中 に矢印で示した。

加速電圧を上げることでカソードの電流密度が増 加するということは、この電子銃内のビームがラン グミュアの式で表記されるところの空間電荷制限領 域に入っていることを示しているから、より高いカ ソード電流密度を得るためにはグリッド - アノード 間の加速電圧を上げてビームの引き出しを行わなけ

[†]hozumiy@post.kek.jp

ればならない。今後、加速電圧を 200 kV 程度まで 上げる予定で、その準備を進めているところである。



図1. 電流密度 - 電界強度特性

2.3 Fowler-Nordheim プロット

図 2 は、図 1 のデータを Fowler-Nordheim (F-N) プロットで表したものである。よく知られてい るように、このプロットの傾きが直線であるならば、 この電子放出は量子力学で理解されるトンネル効果 に起因していることの証拠となる。本試験での電子 放出機構も、図 2 によりトンネル効果によるもの と確認された。このプロットの傾きから電界増倍係 数 β を求めることができるが、F-N の式は次の (1)式で表される。

$$\ln(I/E^2) = \ln(a) + b(\phi^{3/2}/E)$$
(1)

ここで、

 $a = 1.54 \times 10^{-6} A \beta^{2} / \phi,$ $b = -6.83 \times 10^{7} / \beta$ (2)

となる。

グラフの横軸を 1/E にとると、傾きは仕事関数 ϕ と電界増倍係数 β の関数となる。図 2 での Eの次元は MV/m である。CNT の仕事関数は種々の 値が報告されてきており、 β 因子の算出に 5 eV を 採用している報告も多いのだが、概ねグラファイト のそれと変わらないことを勘案して、今回の計算で は高配向性グラファイト (HOPG)の仕事関数 4.4 eV を用いることとする。以上を考慮して、F-N プ ロットの傾き ζ から β 因子は、

$$\beta = -6.3 \times 10^4 \,/\,\zeta \tag{3}$$

と求めることができる。

図 2 の F-N プロットの傾きの直線部分の付近か ら算出される β 因子の値(図2参照)は、CNT 1本 に対して十分に電界が印加されているときの β 因 子の値^[5]と一致することが判明した。これは本カ ソード上の CNT 密度が適当な量であるため、カ ソード上の個々の CNT に十分な電界集中が引き起 こされたことを示すものであり^[6]、理想的な条件下 で電子放出がなされたと見なすことができるのであ り、カソード全面に亘る β 因子の平均値が CNT 1 本に理想的に電界集中している時の値と等しいとい う別の表現も可能である。本カソードと電界集中に 関する、より詳しい議論は 3 章で展開する。



図2. Fowler-Nordheim プロット

2.4 CNT**カソードの**寿命試験

図 3 に 24 日間に及ぶ CNTカソードの寿命試験 の結果を示す。初めの3日間と、ランニングの途中 で電流値がゼロ付近に落ちているのは、それぞれ測 定系の調節とテストスタンド内に立ち入る必要が あったために一旦ビーム加速をストップしたからで あり、その間もグリッド - カソード間での電子放出 は行われていた。測定条件は、加速電圧 100 kV、 パルス幅 8 ns、繰返し数 50 pps であり、グリッド - カソード間の電界強度はおよそ 9.1 MV/m、ビー ムの加速スペースであるグリッド - アノード間の電 界強度は 3.2 MV/m 程となっている。

2.3 節で述べたように、このときの加速電圧、つ まりグリッド - アノード間の電界強度を上げるとア ノード電流が増えるので、実際は CNT からより多 くの電流が得られているはずである。今回のランニ ングはカソードの電流密度が 7.2 A/cm² 付近で行っ ているが、本来、実電流を算出する際には、グリッ ドに流れ込む電流の分も勘案すべきであって、この 値よりも 30 % 程は上乗せして計算すべきである。 よって、実質 9.4 A/cm² 付近でのランニングを行っ たことになる訳である。加えて、2.2 節で議論した ように今回は空間電荷領域でランニングを行ったの であるから、ビームが十分に引き出されてビーム キャッチャで捕らえられておれば、10 A/cm² 以上 は裕に超えた領域でビーム試験が行えたはずである、 とこの結果は示唆しているのである。

いずれにしても約 3 週間に渡って安定したビー ムが得られたことは特筆すべきことである。24 日 間のランニングで、放出電流は約 1.3 % の減少に 留まった。





図3. CNTカソードの寿命試験

3 . CNTカソードの表面観察



図4. ビーム試験前



図5.ビーム試験後

図 4 は、FE-SEM による高電界印加前のカソー ド表面の像であり、図 5 は、ビーム試験後のカ ソード表面の写真である。両写真ともカソードの中 心付近の様子を撮影したものである。それに先立ち、 カソードの全面に亘って観察を行っており、場所に よる形状の違いがないことを確認している。

図 4 と図 5 を比較すれば明らかで、高電圧印加 後の CNT 密度は印加する前のそれと比べて、低く なっている。本カソードの CNT エミッタ群はファ ン・デル・ワールス結合でバンドル構造を成してお り、基板に対して浮いている弱い結合を持つ CNT も多いために、カソード基板にしっかりと根を下ろ している強い結合を持つ CNT 以外は、印加電界を 強めるに従い、破壊・飛散が進み、結果として 2.2 節で述べたように電子放出サイトが減少して CNT 密度が最適化されてカソードのコンディショニング が進む。その結果、電子放出特性の安定化も進んで ゆくのである。

4.結論

高純度 CNT 陰極を用いて、8 ns の実用的なパル ス幅にてビーム試験を行った結果、9.1 A/cm² もの カソード電流密度が得られた。この値は一般的な熱 陰極である含浸型カソードの放出電流密度に迫るも のであり、CNT 冷陰極を持つ高輝度電子銃の実用 化が見えてきた。また、CNTと基板とのオーミック 接触抵抗による、エミッション電流の抑制が報告さ れている^[7]ので、今後加速電圧を上げてよりカソー ド電流密度が増して行くと問題になってくるものと 思われる。この対策も講じてゆきたい。

謝辞

(株)JFEエンジニアリングには高純度 CNT カ ソードを提供していただいた。また、文部科学省ナ ノテクノロジー総合支援プロジェクト(NPPP)の ご協力により、産業技術総合研究所ナノプロセッシ ング施設において高分解能電界放出走査型電子顕微 鏡を使用することができ、本稿にその観察像を登載 することができた。ここに記して感謝申し上げる。

参考文献

- [1] 穂積康文ら、"カーボンナノチューブ冷陰極を持つ電界 放出電子銃の開発"、第29回リニアック技術研究会プ ロシーディングス、pp. 350-352 (2004).
- [2] J. M. Bonard et al., "Field emission from carbon nanotubes: the first five years", Solid State Electronics, vol. 45, pp. 893-914 (2001).
- [3] Y. Saito et al., Jpn. J. Appl. Phys., vol. 39, p. 346 (1998).
- [4] 大沢哲ら,"カーボンナノチューブ冷陰極の特性測定", 第28回リニアック技術研究会プロシーディングス, pp. 120-122 (2003).
- [5] 森久祐司ら、"カーボンナノチューブ1本による微小 電界放射電子源の作成と評価",島津レビュー,vol. 60, No. 1.2, pp. 25-33 (2003).
- [6] L. Nilsson et al., "Scanning field emission from patterned carbon nanotube films", Appl. Phys. Lett., vol. 76, No. 15, pp. 2071-2073 (2000).
- [7] J. B. Cui et al., "Control of field emission current of individual sites by a local resistor", J. Vac. Sci. Technol. B vol. 20(1), pp. 19-24 (2002).